

SSD故障解析・NAND診断調査

SSD障害解析は、障害事象の状況診断とコントローラー／NANDチップの不具合の調査により故障原因を調査。

障害解析は大きく3つのステージに分けて実施致します。

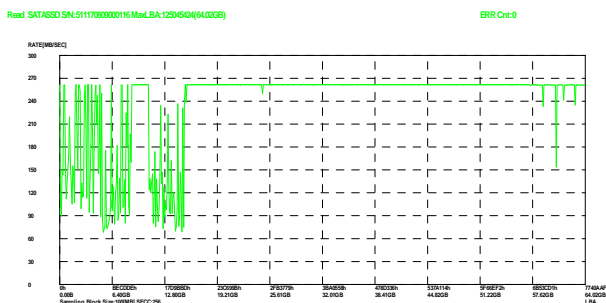
一次診断(状況調査)

起動しないSSD／故障したSSDのIDENT情報／SMART情報を弊社のテスターで取得し、SSDの状態を調べます。

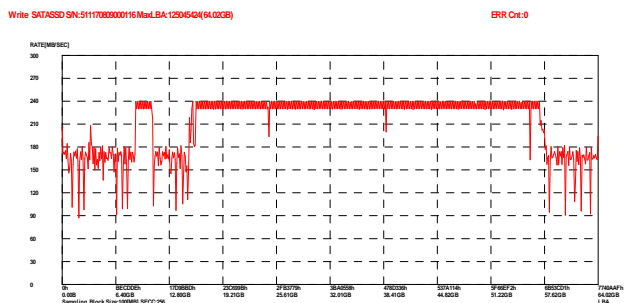
アクセス出来ない障害要因のBADブロックを修正して、性能調査とERROR有無の調査を行います。また、トップカバーを外してチップ外観調査を行います。

診断結果を報告し、二次診断・三次診断への提案を行います。

Read 性能測定



Write 性能測定



IDENT 情報取得

00	General configuration info	0C5A
01	Default logical # of cylinders	3FFF
02	Specific configuration	C837
03	Default logical # of heads	10
06	Default logical # of secs/trk	003F

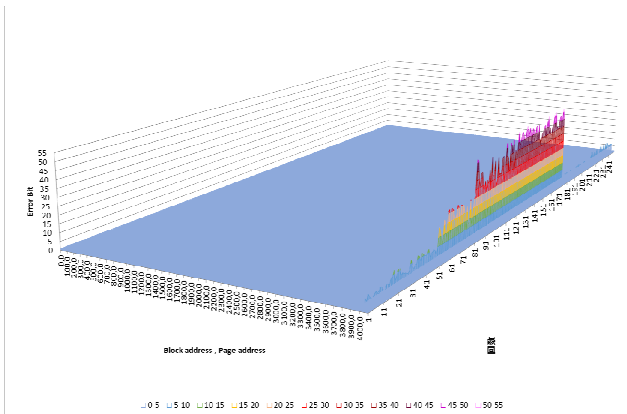
SMART 情報取得

ID:1	Read Error Rate	000600000000 0 000000000000 0
ID:5	Reallocated Sectors Count	00000000000B 11 00000000000B 11 代替処理された不良セクタの数
ID:9	Power-On Hours	7F8800000E85 3717 27100000E86 3718
ID:12	Device Power Cycle Count	0000000005D8 1496 0000000005D9 1497
ID:171	SSD Program Fail Count	000000000000 0 000000000000 0
ID:172	SSD Erase Fail Count	000000000000 0 000000000000 0
ID:174	Unexpected power loss count	000000000043 67 000000000043 67 予期しない電源断回数

二次診断(コントローラー、NANDチップ 調査)

コントローラー、NANDチップの切り分け調査を行います。
結果と原因推定・考察を記した調査結果を報告します。

ECC エラー調査



NANDチップ内のBlock AddressとPage Address
におけるエラーレート

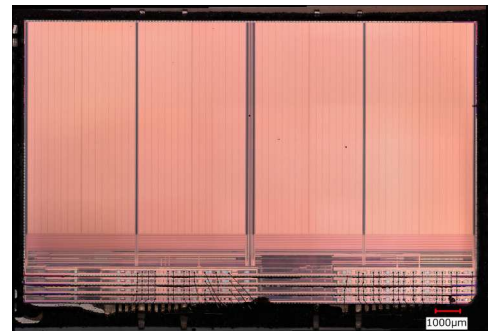
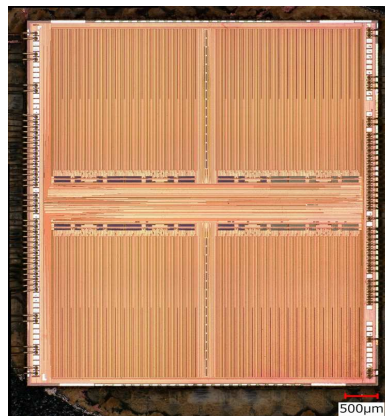
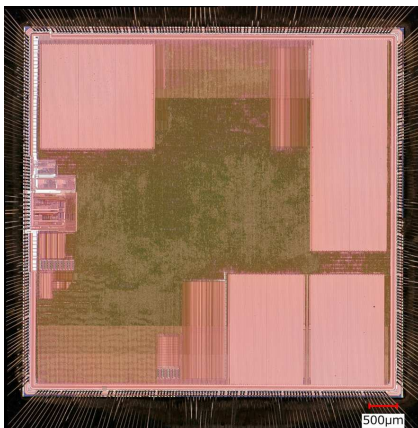
分解調査



SSD 内部

三次診断(コントローラー・NANDチップ表面と断面 調査)

障害再現、原因追及の調査を行います。
結果と原因推定・考察を記した調査結果を報告します。



異常個所の調査(樹脂残差もしくは、付着異物の有無確認)

- 本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。
- 本カタログの写真と実際の製品では一部異なる場合があります。また、内容は改良のため予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品(ソフトウェアを含む)が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。

お問い合わせは下記へ

三映電子工業株式会社
〒385-0002 長野県佐久市上平尾 801
Tel. 0267-78-5010 Fax. 0267-78-5011
E-mail info@sanei-j.com URL <http://www.sanei-j.com/>
東京営業 Tel. 03-5999-8801 Fax.03-5999-8807

 **SAN-EI**
三映電子工業株式会社